## 11;12

## Спектроскопическое исследование термической стабильности связанного в *а*-С: Н водорода

© В.И. Иванов-Омский, Г.С. Фролова, С.Г. Ястребов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

## Поступило в Редакцию 14 декабря 1996 г.

Исследовано равновесие свободный-связанный водород в аморфном гидрогенизированном углероде методами ИК-спектроскопии. Обнаружен квазиобратимый характер ухода водорода из связанного состояния. Приводится оценка энергии активации химической реакции связанный-квазисвободный водород. Сделана оценка скорости возвращения водорода в связанное состояние. Предложена энергетическая диаграмма реакции связанный-квазисвободный водород.

Гидрогенизированный аморфный углерод (a-C:H) находит широкое применение в технике благорадя таким примечательным свойствам, как высокие электрическое сопротивление, химическая устойчивость, оптическая прозрачность в широком диапазоне длин волн и привлекательные трибологические характеристики. Принято связывать эти характеристики с содержанием водорода, входящего в (a-C:H) в различных состояниях. При этом детектирование связанного водорода по инфракрасным колебательным спектрам не вызывает трудностей [1] в отличие от свободного водорода, регистрация которого возможна лишь в толстых пленках из-за недостаточной чувствительности ядерного магнитного резонанса. Кроме того, проблема состояния "свободного" водорода в (a-C:H) остается открытой.

1



**Рис. 1.** Оптическая плотность (*αd*) колебательной полосы С-Н связи в *a*-C:H.

В данной работе предпринята попытка выяснить состояние "свободного" водорода в (a-C:H) с помощью исследования равновесия (связанный водород — свободный водород) методом инфракрасной спектроскопии. Измерялсь оптическое пропускание в области колебательных частот углерод-водородных связей в (a-C:H) в зависимости от температуры послеростового отжига. Слои a-C:H были получены методом магнетронного распыления в атмосфере аргон-водородной плазмы (4:1) при давлении в рабочей камере порядка 10 мТор. Температура подложки достигала 200 °C. Энергия ионов аргона составляла величину порядка 100 эВ. Слои a-C:H наносились на кремниевые подложки. Измерения прямого пропускания проводились с помощью двухлучевого спектрофотометра Specord 75IR.

Фрагмент типичных спектров пропускания a-С:Н в области колебаний растяжения С–Н связей приведен на рис. 1. Структура полосы свидетельствует о преобладании  $sp^3$  связей углерода в исследованном материале.



**Рис. 2.** Оптическая плотность полосы в зависимости от температуры одночасового отжига. Прямоугольники и кружки — экспериментальные точки для двух образцов *a*–C:H. Треугольники — литературные данные. Сплошные линии — результат подгонки *I* к экспериментальным точкам.

Отжиг образцов проводился в вакууме в интервале температур 100-450 °C как в изохронном, так и в изотермическом режимах. Для оценки влияния отжига на состояние водорода в слоях а-С:Н измеренные спектры пропускания на длине волны, соответствующей максимуму поглощения полосы, пересчитывались в оптическую плотность (логарифм коэффициента пропускания). Считалось, что толщина пленки не зависит от времени отжига, а коэффициент поглощения зависит линейно от концентрации С-Н связей в пленке а-С:Н, т. е. температурная зависимость оптической плотности соответствует температурной зависимости концентрации связанного водорода. На рис. 2 приведена зависимость оптической плотности колебательной полосы связанного водорода от температуры одночасового изохронного отжига для двух образцов. Для сравнения на рис. 2 показаны литературные данные для зависимости концентрации водорода *а*-С:Н от температуры [2]. Как видно, полученные в этой работе зависимости концентрации водорода от температуры находятся в разумном согласии с литературными данными

по прямому определению концентрации водорода. Предполагая, что уменьшение концентрации связанного водорода, регистрируемого по ИК спектрам, связано с переходом его в другое состояние, можно записать зависимость концентрации водорода в этом состоянии N от температуры в виде

$$N = N_0 (1 - \exp(-E_1/kT)), \tag{1}$$

где  $E_1$  — энергия активации перехода,  $N_0$  — концентрация связанного водорода, T — температура, k — постоянная Больцмана. Результат процедуры подгонки для значений  $E_1 \sim 0.5 \pm 0.2$  эВ, представленный на рис. 2 сплошными линиями, находится в разумном согласии с экспериментом. Принимая во внимание аморфный характер материала и ограниченность температурного интервала измерений, мы вынуждены ограничиться достигнутой точностью. Кроме того, видно, что связанное состояние водорода исчезает в результате часового отжига при температуре порядка 400–450 °C, что также находится в неплохом согласии с литературой [2].

Неожиданным, однако, оказалось то, что по прошествии некоторого времени связанное состояние водорода восстанавливается даже при комнатной температуре. Этот факт показал, что в результате термического отжига в вакууме водород, покидая связанное состояние, остается в образце, по-видимому не сильно удаляясь от исходной позиции. На рис. З представлены зависимости от времени оптической плотности в области полосы колебательных частот связанного водорода при двух температурах для образцов а-С:Н, предварительно отожженных при  $T = 450 \,^{\circ}\text{C}$  до полного исчезновения полосы (рис. 2). Видно, что скорость восстановления оптической плотности зависит от температуры, возрастая с температурой. Сам факт восстановления полосы указывает на квазиобратимый характер процесса при отжиге, который можно рассматирвать как термическое возбуждение связанного водорода в состояние, характерные частоты которого не регистрируются в исследованной области спектра. Отметим, что восстанавливется не только интенсивность полосы, но и ее форма.

Величина энергии активации  $E_1$  разумно коррелирует с величиной разности энергий отрыва водорода от молекул типа этилена  $C_2H_6$ , равной 5.2 эВ, и энергии образования молекулы свободного водорода 4.5 эВ [3]. Считая энергию активации величиной барьера, разделяющего связанное и несвязанное состояния водорода, можно построить энерге-



**Рис. 3.** Кинетика восстановления оптической плотности полосы, нормированной на ее максимальное значение  $\alpha_0$ . Прямоугольники — экспериментальные данные по восстановлению образца при комнатной температуре, треугольники — при температуре 150 °C. Сплошные линии — результат экспоненциальной интерполяции.

тическую диаграмму процесса, как показано на рис. 4. Величина  $E_2$ , определяющая высоту барьера обратной реакции восстановления связанного состояния водорода, может быть оценена с помощью уравнения для абсолютной скорости реакции в форме

$$V(T) = V_0 \exp(-E_1/kT).$$

Экспоненциальный характер зависимости рис. 3 согласуется с этим уравнением. Полагая предэкспоненту  $V_p$  не зависимой от температуры, имеем для двух температур  $T_1$  и  $T_2$ :

$$E_2 = k(T_1T_2/(T_1 - T_2))\ln(V_1/V_2).$$

Отношение  $V_1/V_2$  может быть определено из данных рис. 3. В результате для величины  $E_2$  получаем оценку 0.15 эВ. Приписывая обратной



**Рис. 4.** Энергетическая диаграмма процесса перехода водорода из квазисвободного состояния 2 в связанное *1*.

реакции туннельный механизм перехода водорода в связанное состояние, можно оценить порядок величины ширины барьера, изображенного на рис. 4, между состояниями 1 и 2. Для этого запишем частоту актов туннелирования в виде  $\omega = \omega_0 \exp(-d/d_0)$ , где  $d_0 = \hbar/(2m_pE_2)^{0.5}$  ( $\hbar$  — постоянная Планка,  $m_p$  — масса протона). В качестве  $\omega_0$  можно принять собственную частоту осциллятора с энергией связи  $E_2$ , соответствующую состоянию 2:  $\omega_0 = E_2/\hbar = 2.2 \cdot 10^{14} \, c^{-1}$ . В результате такой процедуры получаем ширину барьера  $d \sim 1.5$  А. Эта величина соответствует удалению водорода, находящегося в возбужденном состоянии, от его первоначального положения. Близость оценки к полуширине графитового кольца приводит к мысли о том, что в качестве возможного депо для термически возбужденного водорода могут выступать фрагменты плоскостей графитоподобной составляющей структуры a–С:Н. Сама величина ( $\sim 0.15$  эВ) энергии связи водорода в возбужденном состоянии характерна по порядку величины для ван-дер-ваальсовых сил связи.

Такую связь можно ожидать при взаимодействии между водородом и легко поляризуемой  $\pi$ -электронной системой графитовых кластеров. Благодаря этому взаимодействию имеет место адсорбция водорода на графитоподобных фрагментах структуры, образованных атомами углерода в  $sp^2$ -состояниях. При понижении температуры водород переходит в основное состояние, связываясь с атомами углерода в  $sp^3$ -состоянии путем туннелирования через барьер. Таким образом, при температурах ниже 450 °C водород не покидает a-C:H, а находится в связанном или адсорбированном состояниях. Можно поэтому думать, что в нормальном состоянии a-C:H не содержит свободного водорода.

Следует подчеркнуть, что полученные оценки параметров предложенной модели не могут претендовать на роль констант материала, так как сильно зависят от его предыстории, например температуры подложки в процессе роста пленки [2]. Роль сделанных оценок ограничивается демонстрацией правдоподобия модели и пригодностью для интерполяций при заданной технологии материала.

Работа поддержана грантом РФФИ № 96-02-16851-а и грантом Аризонского университета.

## Список литературы

- [1] Grill A., Patel V. // Appl. Phys. Lett. 1992. V. 60. N 17. P. 2089.
- [2] Grill A. in Syntetic Diamond: Emerging CVD Science and Technology / Ed. K. Spear, J.P. Dismukes. Wiley, New York, 1994. P. 130.
- [3] Moustakis T.D. Ibid. P. 145.